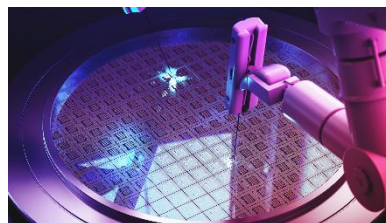


半導体測定トレンドとテクニック

半導体パラメトリック・アナライザ オンラインデモ週間



材料、半導体、デバイス特性評価等で頻繁に用いられる半導体パラメータアナライザですが、デバイスの高速化や微細化に伴い、従来の IV 評価だけでなく CV 評価、高速評価、信頼性評価等、様々な評価が求められるケースが増えてきました。また設備更新に当たって技術面、オペレーション面で種々お悩みを抱えられる方も少なくありません。

本イベントでは 1 社様限定のオンライン会議を通じて半導体測定のためのソリューション紹介と製品デモをご覧頂きます。設備更新の検討材料としてご活用ください。

開催概要

日時	2026 年 11 月 9 日(月)～11 月 13 日(金) ① 10:00 - 12:00 ② 13:00 - 15:00 ③ 15:30 - 17:30 ※1 日につき 3 スロット(全 15 スロット) : お好きな時間を選択ください。	
会場	オンライン : 1 社様限定の会議形式で行います	
参加費	無料(事前登録制)	
申込み	こちらのフォームよりご登録ください。 https://forms.cloud.microsoft/r/tyzX2mjsp5	



内容

- 半導体市場背景と最新測定事情
- キーサイト半導体測定ソリューションのラインナップ紹介
- 【実演デモ】測定系構築におけるテクニック
 - 微小電流評価、CV 評価、Pulse 評価等
 - 制御ソフト EasyEXPERT を使った解析機能、データ管理機能、シーケンス構築機能等
- お悩み相談会

講師: ソリューション営業本部 ソリューションエンジニア



B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ



B1505A / 6A パワー・デバイス・アナライザ

注意事項

・講師は変更になる場合がございます。万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。また、競合他社様は、ご参加を遠慮いただく場合があります。あらかじめご了承ください。



キーサイト・テクノロジーの製品、アプリケーション、サービスの詳細については、ウェブサイトをご覧ください: www.keysight.co.jp
キーサイト計測お客様窓口: www.keysight.co.jp/find/contactus

本書の情報は、予告なしに変更されることがあります。

© Keysight Technologies, 2026, Published in Japan, Sep 8, 2026,